DE 100 47 963 A 1

23

andere Bauteilschicht im Schritt des Verbindens an einem anderen klebenden Substrat als dem Halbleitersubstrat befestigt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Halbleitersubstrat (11) aus Silicium (Si) 5 oder Germanium (Ge) hergestellt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 9. dadurch gekennzeichnet. dass die Bauteilschicht (20, 40) durch epitaktisches oder heteroepitaktisches Wachstum auf dem Halbleitersubstrat (11) hergestellt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Schriu des Verbindens der Bauteileinheit zwei Bauteileinheiten (2, 4) unter Verwendung eines Klebers aneinander befestigt werden.

19. Versahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kleber aus isolierendem Material
verwendet wird.

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trägersubstrat mit Durchgangslöchern verwendet wird, die ein Flussmittel zum Lösen 20 des Klebers hindurchtreten lassen.

21. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber in einen vorgegebenen Raum auf der der Bauteilschicht zugewandten Seite des Trägersubstrats eingebracht wird.

22. Verfahren nach Anspruch 2. dødurch gekennzeichnet. dass mehrere Bauteilschichten auf einem Trägersubstrat aufgebracht werden.

23. Verfahren zum Herstellen eines Dünnfilm-Bauteils mit mehreren Bauteilschichten, mit den folgenden 30 Schritten:

- Herstellen einer internen Isolierschicht (130) aus einem isolierenden Material in einer Halbleiterschicht (13) mit einem Paar Oberflächen:

- Herstellen einer ersten Bauteilschicht (20) auf 35 einer Seite der Halbleiterschicht und

- Herstellen einer zweiten Bauteilschicht (40) auf der anderen Seite der Halbleiterschicht.

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Herstellens der internen 40 Isolierschieht (130) Ionen in die Halbleiterschieht (13) implantiert werden.

25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht (13) auf einem eine poröse Schicht einbettenden Halbleitersubstrat herge-

stellt wird.

26. Verfahren nach Anspruch 25. dadurch gekennzeichnet, dass die poröse Schicht durch Anodisieren auf dem Halbleitersubstrat hergestellt wird.

27. Verfahren nach Anspruch 23. dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht durch epitaktisches Wachstum auf dem Halbleitersubstrat hergestellt wird. 28. Dünnfilm-Bauteil mit mehreren Bauteilschichten (20. 40), das eine Licht emittierende Bauteilschicht (80) und eine Licht empfangende Fotodetektorschicht (50) aufweist.

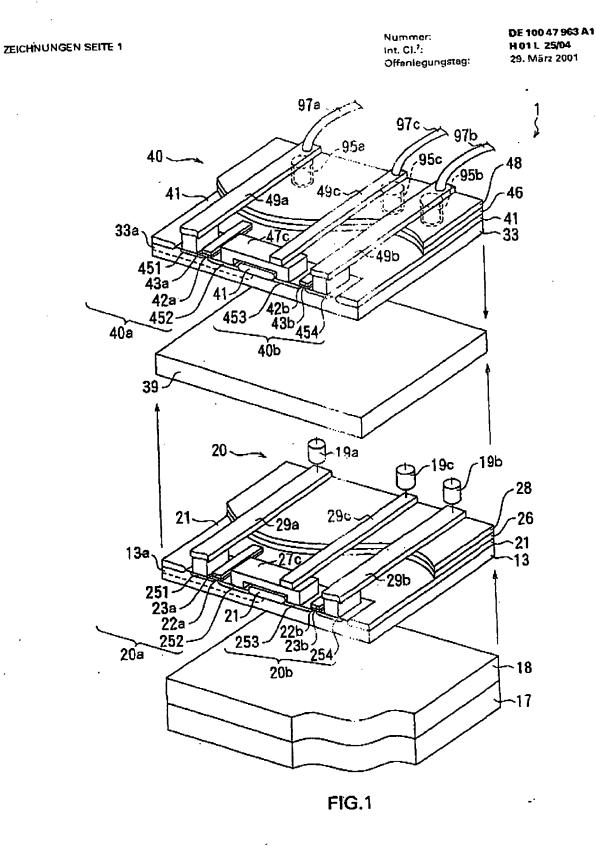
29. Dünnfilm-Bauteil nach Auspruch 28. dadurch gekennzeichnet, dass die Licht emittierende Bauteilschicht (50) unter Verwendung eines Klebers an der Fotodetektorschicht (80) befestigt wird.

30. Dünnfilm-Bauteil nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht emittierende Bauteilschicht (50) so hergestellt wird, dass sie Licht im Wesentlichen rechtwinklig zu einer Oberfläche emittiert.

Hierzu 24 Scite(n) Zeichnungen

24

- Leerseite -

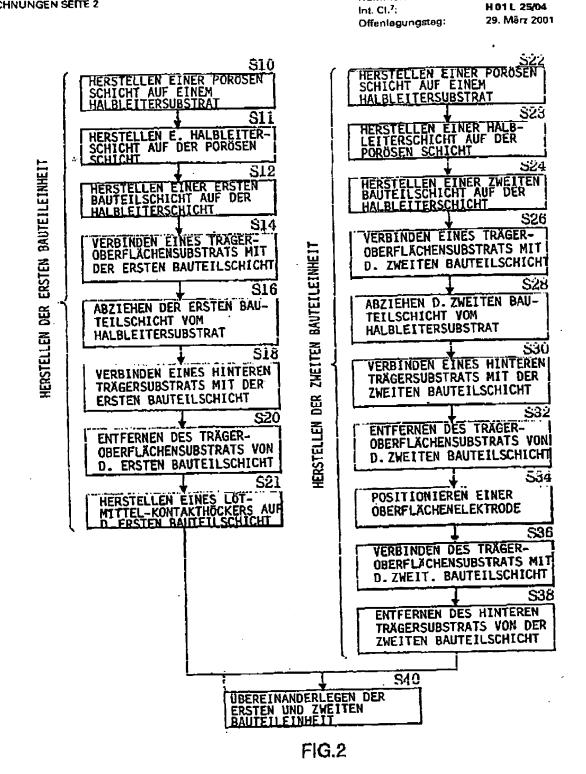


Nummer:

DE 100 47 963 A1

ZEICHNUNGEN SEITE 2

7814019966



Nummer: Int. Cl.':

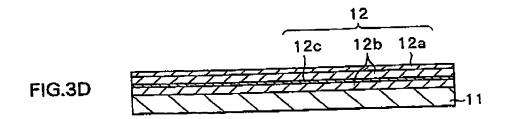
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29, März 2001







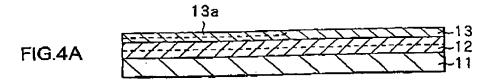


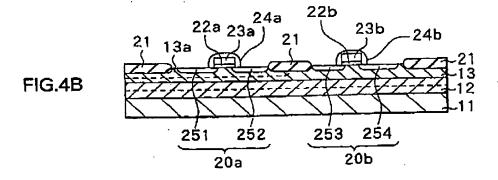
7814019966

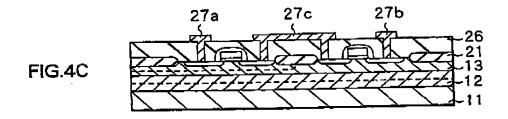
Nummer: Int. Cl.7:

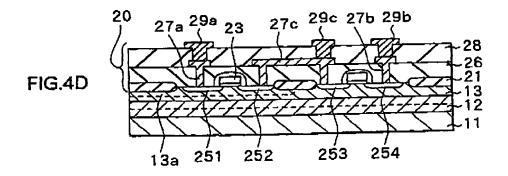
Offenlegungstag:

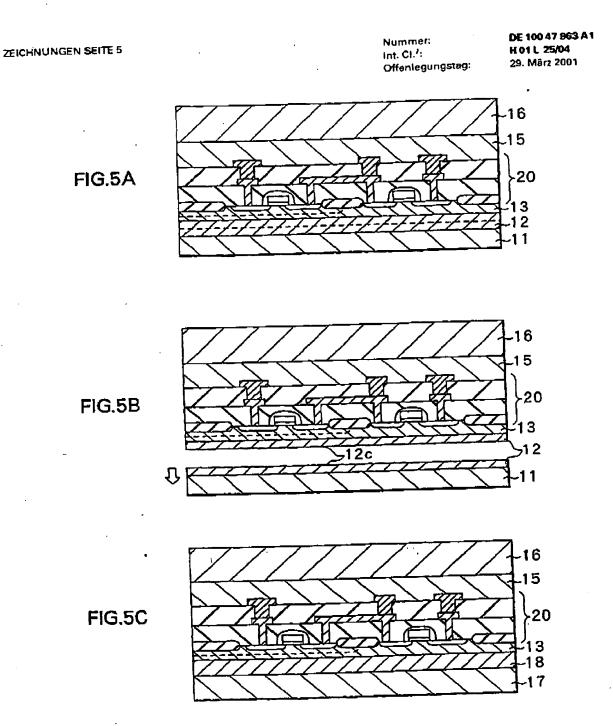
DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001





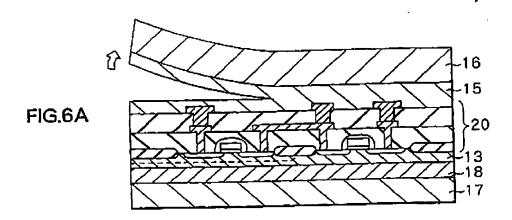


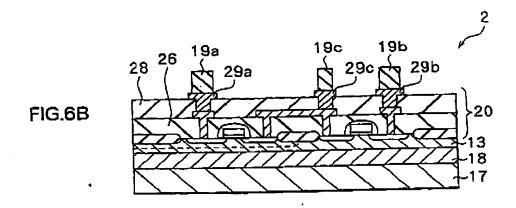




7814019966

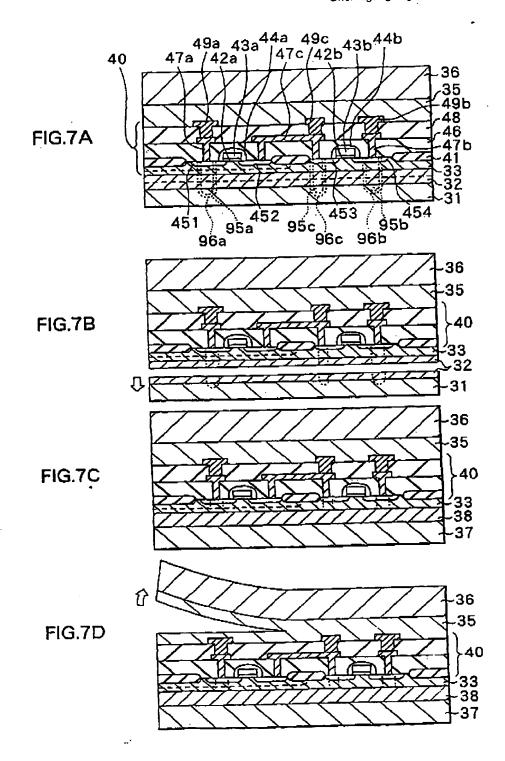
Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001

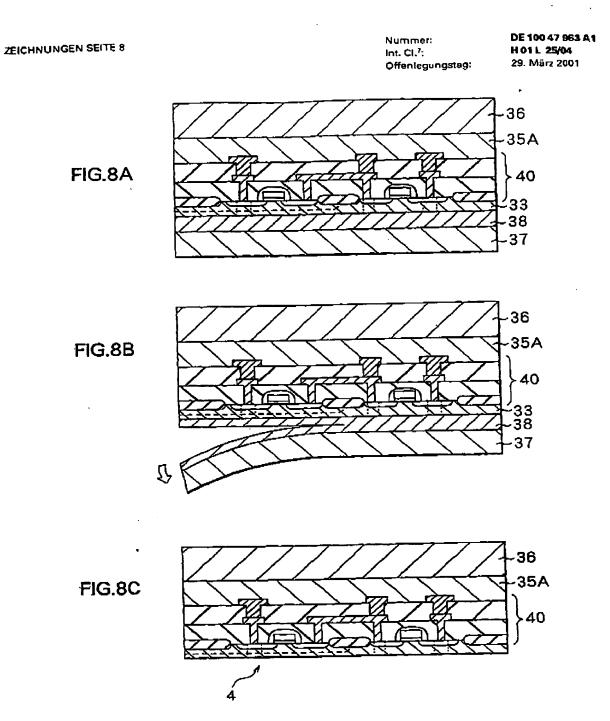


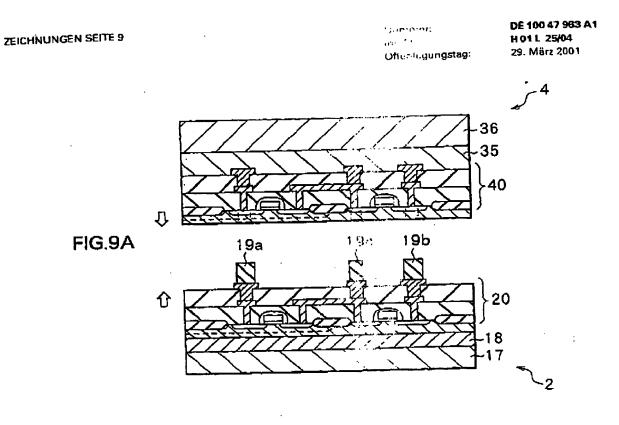


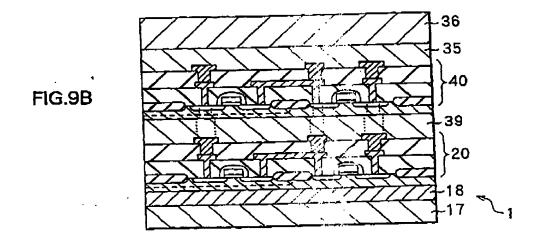
7814019966

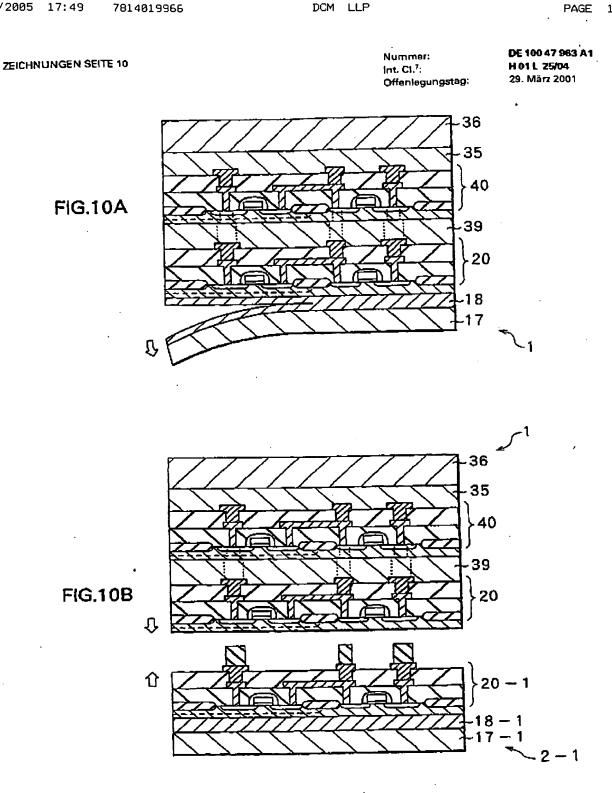
Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlagungstäg: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001











7814019966

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001

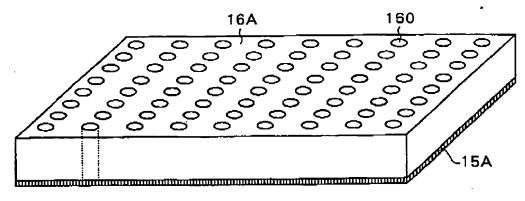
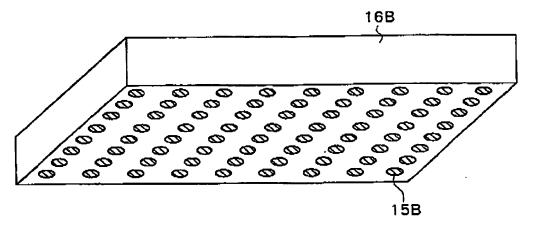


FIG.11



· FIG.12

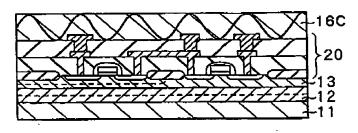


FIG.13

DE 100 47 963 A1

Nummer:

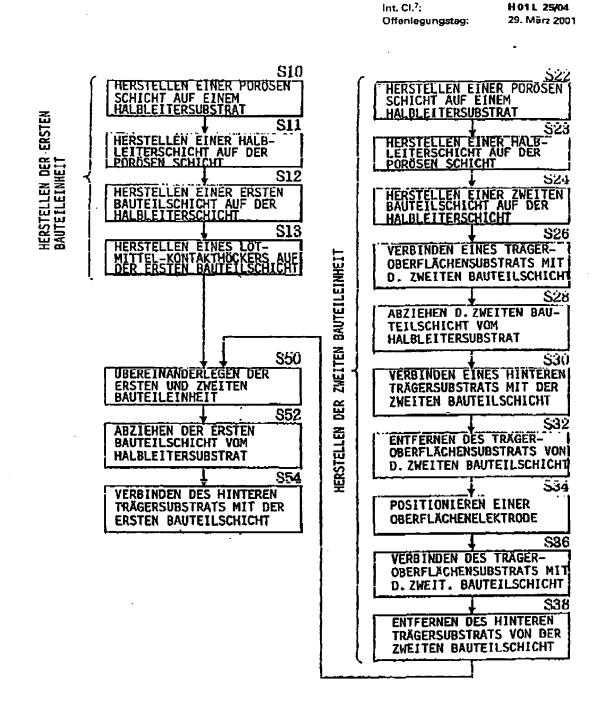
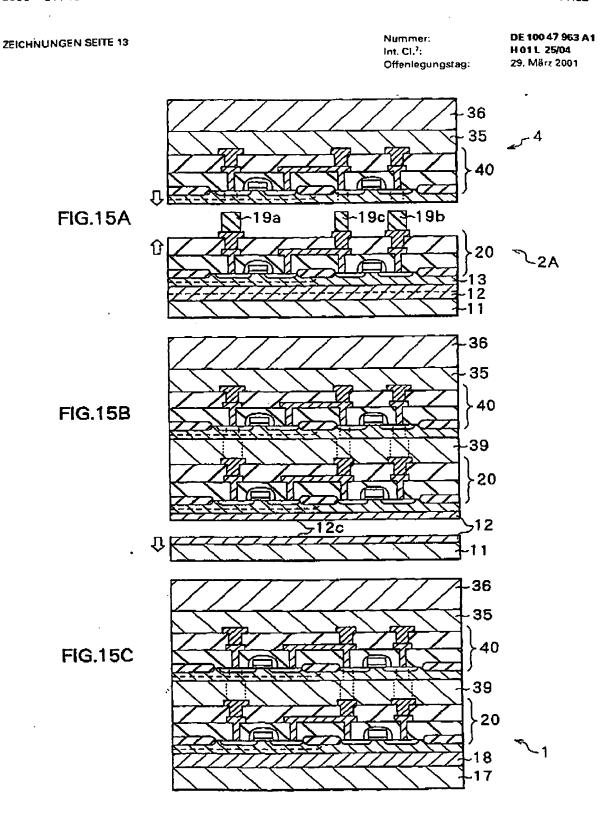


FIG.14



7814019966

Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H01L 25/04 29. März 2001

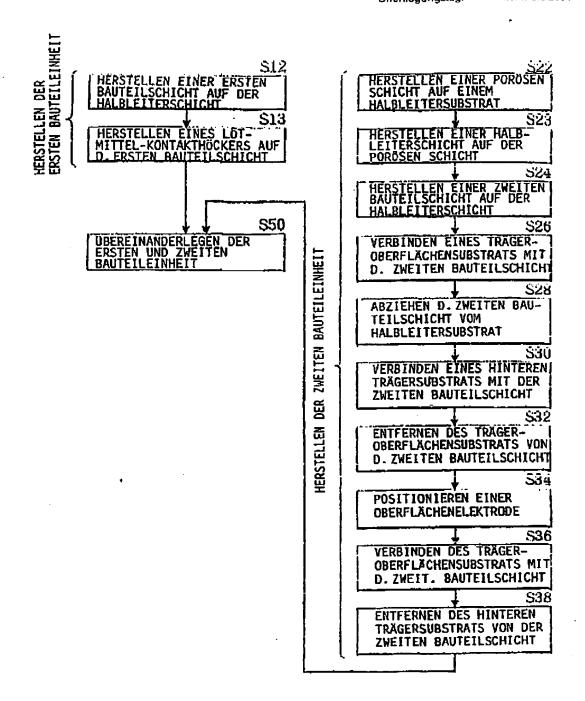
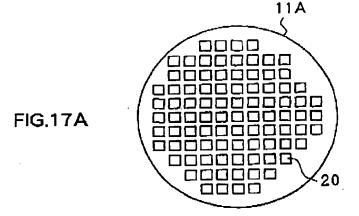
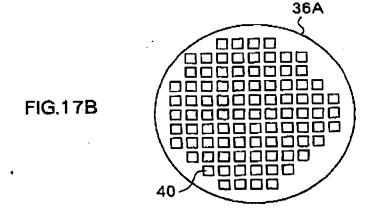


FIG.16

7814019966

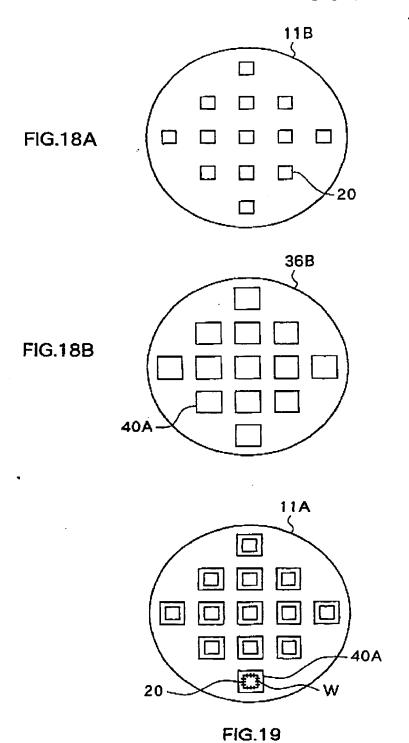
Nummer: Int. Cl.7; Offenlegungstag: DE 100 47 983 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001





7814019966

Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungsteg: DE 100 47 983 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001



Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001



FIG.20

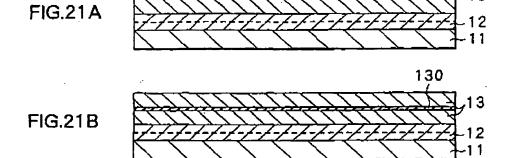


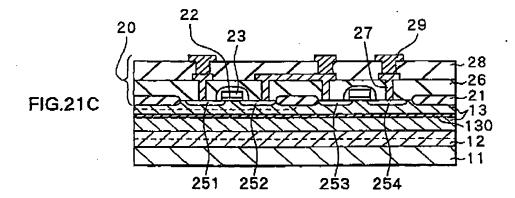
7814019966

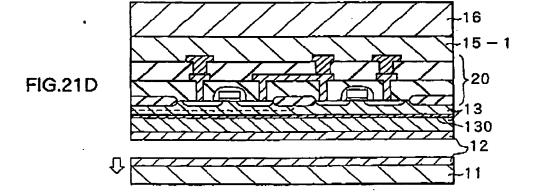


DE 100 47 963 Å1 H 01 L 25/04 29. März 2001

13







Nummer: Int. Cl./: Offenlegungstag: DE 100 47 983 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001

FIG.22A

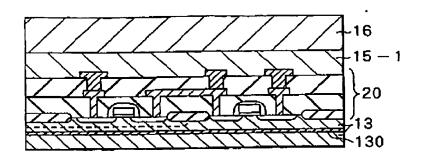
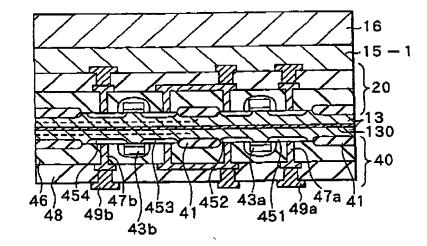
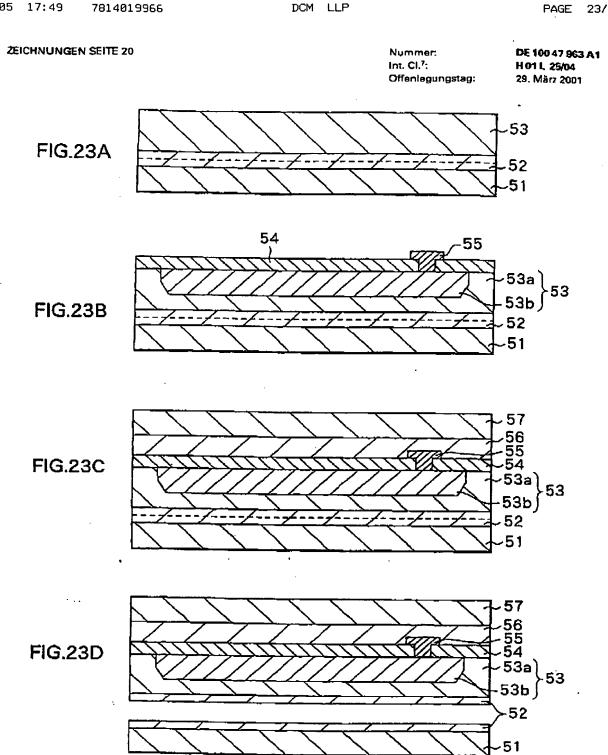


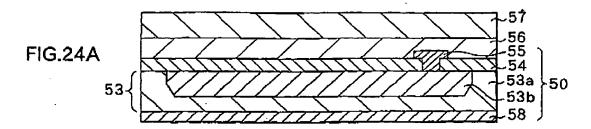
FIG.22B

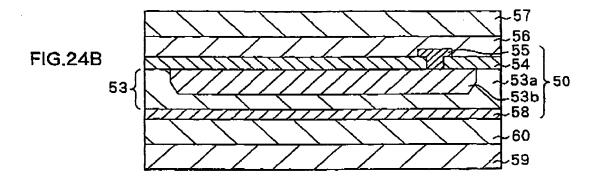


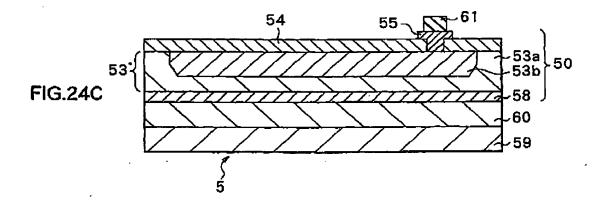




DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März-2001







Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001



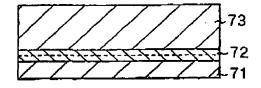


FIG.25B

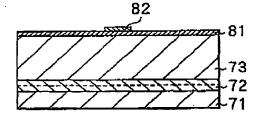


FIG.25C

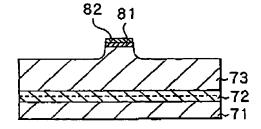


FIG.25D

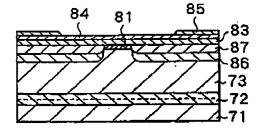
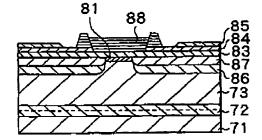
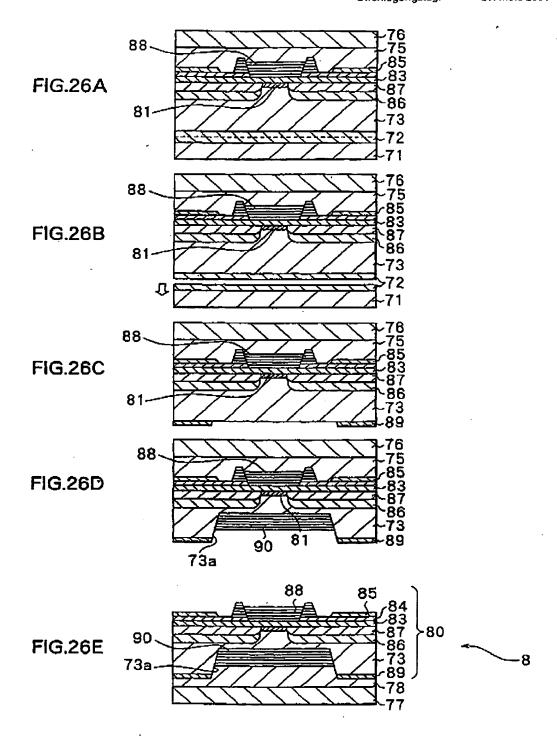


FIG.25E



Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 47 963 A1 H 01 L 25/04 29. März 2001



Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 100 47 963 Å1 H 01 L 25/04 29. März 2001

